X線トポグラフィの三次元化と応用

梶原堅太郎(JASRI)、向出大平(キヤノン)、飯田敏(富山大)、川戸清爾(SAGA-LS)

通常のX線トポグラフィでは構造不均一の分布は 二次元への投影像として観察されるが、三次元分布 の観察方法も開発されている。本講演ではX線トポ グラフィによる三次元観察技術を紹介するととも に、SPring-8のBL19B2およびBL28B2[1]で実施した 観察例を報告する。

トポートモグラフィ手法を備えた白色X線トポ グラフィ[2,3]

CZシリコンのダッシュネッキング過程における転 位の消滅機構を明らかにするために、トポトモグラ フィ手法と白色X線トポグラフィ手法とを組み合 わせた手法で、育成結晶ネック部の転位三次元分布 を調査した[4]。トポ-トモグラフィ手法は、X線CT のように試料を回転させながらそれぞれの回転角 度におけるX線トポグラフ像を取得する方法であ り、このとき回折ベクトルと回転軸を平行にするこ とで、試料を回転させても回折条件が常に満たさ れる。トポ-トモグラフィで転位の形状とすべり面 を決定し、白色X線トポグラフィでバーガースベク トルを決定することができる。図1はBl28B2におけ る実験装置の写真である。試料は[001]引き上げ、 直胴部径2インチのシリコン結晶を用いた。001軸を 回転軸として、試料を回転させながら、004回折ト ポグラフィを観察した。 図2(a)は、トポ-トモグラ フィで得られた004回折トポグラフ像である。無転 位化する直前では転位の多くは結晶表面に達する ことなく成長方向に凸な半ループ形状をして結晶 内部に止まっていることが見て取れる。図2(b)は、 白色X線トポグラフィで得られた111回折トポグラ フ像である。転位の消滅則から半ループ形状の転位 線のバーガースベクトルの方位が<110>であるこ とが分かった。

ステップスキャニングセクショントポグラフ ィ [5, 6]

蛍石の光学特性の分布と結晶性の相関を明らかに するために、ステップスキャニングセクショントポ グラフィで、蛍石内部の亜粒界やすべり面の三次元 分布を調査した。ステップスキャニングセクション トポグラフィは、シート状のX線を試料に照射する ことで、入射X線の光路上の構造不均一を可視化 することができる。このX線の光路からのX線トポ グラフ像が試料の一断面の構造不均一分布を示し ており、試料を走査することで三次元の情報を得 ることができる。試料は、ブリッジマン-ストック バーガー法により[111]方向に育成された蛍石であ り、インゴットから切り出された直径30mmの円柱 形状をしている。図3は、セクショントポグラフ像 を積み重ねて再構成した三次元トポグラフ像であ り、亜粒界などの構造不均一の三次元分布を示して いる。特にすべり面の分布は屈折率の分布と良く一 致しており、屈折率の不均一は結晶構造の不均一に よるものであることが分かった。



Fig.1 Equipment in BL28B2.



Fig.2 Dislocation images in Laue topographs of the neck of CZ silicon crystal using (a) (004) and (b) {111} reflecting planes.



Fig.3 Three-dimensional reconstructed image of part of CaF_2 crystals from the section topographs. (a) 433 and (b) 111 reflections from the samples of diameter 30 mm and 60 mm, respectively.

[1] Y. Chikaura et al.: J. Phys. D 34 (2001) A158-162.

[2] S. Kawado et al.: J. Synchrotron Rad. 11 (2004) 304-308.

- [3] S. Kawado et al.: J. Phys. D 38 (2005) A17-A22.
- [4] W. Ludwig et al.: J. Appl. Cryst. 34 (2001) 602-607.
- [5] T. Mukaide et al.: J. Synchrotron Rad. **13** (2006) 484–488.
- [6] K. Kajiwara et al.: Phys. Stat. Sol. (a) **204** (2007) 2682-2687.